УДК 539.234

Мікроструктура аморфних плівок напівпровідникових матеріалів системи А^IBi₃C^{VI}₅

В.А.Базакуца¹, А.А.Рябчун², Н.Л.Дьяконенко³, І.В.Шелест⁴, В.І.Білозерцева⁵

Харківський державний політехнічний університет, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, ¹тел.(0572)400-347; ²тел.(0572)400-337; ³тел.(0572)400-337, E-mail: dnina@kpi.kharkov.ua; ⁴тел.(0572)400-347; ⁵тел.(0572)400-347, E-mail: beloz@lotus.kpi.kharkov.ua

Проведені дослідження мікроструктури аморфних плівок складних халькогенідів системи A¹Bi₃C^{VI}₅ (A^I - Li, K, Rb; C^{VI} - S, Se) методом просвічувальної електронної мікроскопії та дифракції. Виявлені особливості мікроструктури, зокрема, стовпчаста структура зростання аморфних плівок в залежності від умов їх препарування. Виявлений вплив хімічного складу початкового матеріалу на середній діаметр стовпів в аморфних плівках.

Запропонований механізм утворення стовпчастої структури зростання аморфних плівок сполук, заснований на моделі м'яких трицентрових зв'язків в безперервній неупорядкованій сітці.

Ключові слова: халькогенідні сполуки, аморфні плівки, метода конденсації, стовпчаста мікроструктура.

Стаття поступила до редакції 25.11.1999; прийнята до друку 6.12.1999

I. Вступ

Увагу дослідників залучають тонкі аморфні шари халькогенідних матеріалів, на основі фізико-хімічних властивостей яких вже створені і є можливість побудови нових, різноманітних функціональним за приладів призначенням елементів i пристроїв. Халькогенідні сполуки складного хімічного складу володіють більш широким комплексом властивостей, чим елементарні і бінарні сполучення. Багатокомпонентні конденсати особливий представляють практичний інтерес завдяки можливості плавної зміни їх характеристик при зміні співвідношення компонент і умов отримання. Вивчення багатокомпонентних структури некристалічних матеріалів стикається з великими труднощами, що обумовлено складністю об'єктів і проблематичністю

використання прямих методів дослідження [1]. Це приводить до розробки моделей, заснованих на непрямих вимірюваннях [2].

Одного з різновидів, описаних В літературі аморфних структур конденсатів, є стовпчаста структура, наявність якої вважати надійно встановленою можна прямими електроноскопічним методами [3]. Відомі дослідження стовпчастої структури однокомпонентних плівок, наприклад, аморфного германію [4]. У роботі [5] для складних конденсатів халькогенідних сполучень Ag₃SbS₃, отриманих методом імпульсного лазерного випаровування, виявлені стовпчасті утворення розміром \sim 1000 допомогою растрової HM за електронної мікроскопії. Особливості морфології стовпчатого росту для склоутворюючих речовин досліджував Дж.Філліпс [6, 7]. Його мікроскопічна інтерпретація цієї структури, заснована на



Рис.1. Електронномікроскопічне зображення і мікродифракційна картина плівки К Ві₃ S₅ товщиною 40 нм, яка була сконденсована у вакуумі 10^{-3} Па на скляну підкладку при T = 300 K і ω = 0,1 нм/с; А - ОВІЦ, В - ОНІЦ.

моделі, що співвідносить число міжатомних зв'язків і розмірність простору, знайшла своє експериментальне підтвердження для сполук As_xSe_{1-х.} У ланцюжковій структурі некристалічного селену шляхом введення атомів миш'яку простежується вплив переходу від одномірної ланцюжкової двомірної шаруватої структури до на фізичні властивості. Аналіз фізичних властивостей халькогенідного скла що структура скла в певному показав. діапазоні середніх координаційних чисел створюватися структурними може елементами з різною розмірністю [8].

У даній роботі досліджувалися структурні характеристики і механізм формування аморфних плівок в залежності від складу початкового скла A¹Bi₃C^{VI}₅ (A¹-Li, K, Rb; C^{VI} - S, Se) і умов осадження.

II. Експериментальні методики

Для отримання плівок був використаний резистивного випаровування спосіб речовини з квазізамкненого об'єму. Ступінь умови вакууму відкачки i Р=10⁻³ до P=10⁻⁶ Па варіювалися від (безмасляна відкачка). Плівки товщиною 40-100 нм конденсувалися на скляні при температурі Т = 300К з підкладки швидкістю ω = 0,1 - 0,5 нм/с. Склад плівок контролювався методом лазерної масспектрометрії на енергомас-аналізаторі ЭМАЛ - 2. Еталоном служили атестовані наважки речовини, що випаровується. Мікроструктура плівок вивчалася за допомогою електронної мікроскопії при розрізненні 0,1 нм та електронографії.

III. Експериментальні результати

Електронно-мікроскопічні дослідення показали, що плівки, вирощені у вакуумі 10-³ і 10⁻⁵ Па конденсуються суцільним шаром для всіх досліджених товщин, починаючи з ≈ 5 нм. Типова мікрофотографія структури отриманих у вакуумі 10⁻³ Па, плівок, показана на рис.1. На електронномікроскопічному зображенні за допомогою амплітудного контрасту, пов'язаного з різною прозорістю конденсату, виявляється "сотоподібна" геометрія. Ця картина свідчить про те, що в аморфній плівці мають місце флуктуації щільності: темним ділянкам відповідають області високої щільності (ОВЩ), світлій сітці області низької шільності (ОНЩ) матеріалу плівки.

Електронограми являють собою дифузні гало, які свідчать про аморфну структуру об'єктів, що досліджуються.

Для виявлення залежності розмірів ОВЩ і ОНЩ від складу плівки була проведена комп'ютерна обробка отриманих нами електрономікроскопічних знімків із застосуванням методу січних. Розподіли відносної частоти N розмірів ОВЩ і ОНЩ для плівок КВі₃S₅ i RbBi₃S₅ товщиною 40 нм представлені на рис.2 (а, б, в, г). Розподіл по розмірах нос-ить монодісперсний характер: лля плівок, що містять рубідій, середній розмір ОВЩ становить 9,4 нм, ОНЩ -1,9 нм, а для плівок з калієм 6 і 1,4 нм відповідно. Для плівок, сконденсованих сполуки i3 LiBi₃S₅, на електрономікроскопічних зображеннях не вдалося отримати контраст областей різної і провести їх статистичну щільності обробку. Це, очевидно, пояснюється їх дрібнодисперсністю, яка порівнюється з розрізненням електронного мікроскопа.

Внаслідок проведених масспектрометричних досліджень було встановлено, що склад отриманих

Рис.2. Розподіл відносної частоти N розмірів d OBЩ (а, в) і ОНЩ (б, г) для плівок RbBi₃ S₅ (а, б) і K Bi₃ S₅ (б, г).

випаровуванням з квазізамкненого об'єму конденсатів відповідає стехіометричному складу наважки.

Потрібно зазначити, що для всіх плівок, отриманих у вакуумі Р<10⁻⁵ Па, задовільний контраст, відповідний топологічним фрагментам при розрізненні 0,1 нм, знайти не вдалося.

IV. Обговорення отриманих результатів

×

Серед сполук Li - K - Rb із збільшенням радіусу іону лужного металу має місце тенденція до збільшення середніх розмірів кластерів. Вплив розміру іонного радіусу на особливості складних халькогенідних сполук узгоджується з результатами ряду робіт. Авторами [8-9] показано, що хімічна

 $A^{1}B^{V}C^{VI}$ В системах взаємодія по двокатіонному типу зростає в ряду Li-Na-K-Rb. У вказаному напрямі росте ширина забороненої зони, іонна складова зв'язку, тенденція склоутворенню, ЛО палає температура плавління. 3 зростанням іонного радіуса спостерігається зростання стійкості сполук типу А¹Ві₃S₅. Якщо в системі Li₂S - Bi₂S сполучення LiBi₃S₅ має інконгруентний характер плавлення, в K₂S - Bi₂S воно утвориться в системі твердій фазі, то в системі Rb₂S - Bi₂S утвориться конгруентно плавке сполучення RbBi₃S₅.

Проведені дослідження дозволяють запропонувати механізм зростання аморфних плівок А^IBi₃C^{VI}₅, відповідно до уявлень про утворення кластерів,



Рис.3. Кластерна модель (А, В, С - окремі кластери, — - ковалентні зв'язки, отототото - трицентрові зв'язки, — - - - - міжкластерний кордон.

Дембовським С.А. [10]. У розвинених процесі зростання мала рухливість атомів і розгалужений контур окремих острівців призводить до того, що не всі атоми речовини, що попадають в міжкордонний простір, можуть знайти місце, відповідне мінімуму їх енергії. Внаслідок цього в області між острівцями утворюється напружений кордон. в якому безперервної концентруються дефекти неврегульованої сітки (БНС): спотворені довжини і кути зв'язків. Згідно з моделлю Дембовського [10], це кордони, утворені за рахунок трицентрових зв'язків (ТЦЗ). розташовані Трицентрові зв'язки R ковалентній сітці не хаотично, а групуються в межах двумірніх дефектів. Квазіїзольована область, обмежена ТЦЗ, собою явля€ кластер, який можна розглядати як область середнього порядку (рис.3).

Кластери можуть об'єднуватися В глобули (рис.1). Їх структурне узгодження здійснюється рахунок складних за багатоатомних ТЦЗ, належать ЩО сусіднім одночасно кластерам. Такі трицентрові зв'язки повинні краще, ніж одиночні, переносити напруження, які при сполученні жорстких виникають разорієнтованих кластерів. Отже, на початкових стадіях зростання шарів

виникають області високої шільності, що являють собою кластери і сітку областей низької щільності, так звані міжкластерні кордони, які програмують подальше трьохмірної утворення стовпчастої структури. Із зростанням товщини плівки БНС. яка складається 3 жорстких може ковалентних зв'язків, не реалізуватися в трьохмірному просторі в макроскопічних масштабах. Плівка повинна періодично уриватися леякими розрізами, що містять ослаблені зв'язки. Ha таких ослаблених трицентрових механічні зв'язках релаксюють напруження, шо призводить до формування кластерних кордонів i утворення глобул [10]. З'єднанка кластерів с утворенням глобул в безперервній неупорядкованій сітці ми спостерігали для плівок LiBi₃Se₅ товщиною 800 А.

Ше одним доказом стовпчастої структури є ОВЩ довгастої форми (рис.1). Такі структури спостерігалися на плівках, сконденсованих на підкладки. шо розташовані під кутом до молекулярних пучків. Уявлення про стовпчасту структуру халькогенілних склалних сполук. які містять лужний метал, узгоджується з експериментальних результатами досліджень [3-5].

Наведені результати свідчать, що для плівок сполук А^IВі₃С^{VI}₅, сконденсованих в умовах вакууму Р=10-5 Па міжкластерні кордони не перевищують 0,1 нм. При конденсації у вакуумі Р=10-3 Па, як на стадії зародження, так і на стадії зростання плівки взаємодіють i3 залишковою атмосферою установки, що їх морфологію. Механізм впливає на формування аморфних плівок з такими прошарками можна зв'язати з різною адсорбційною здатністю кластерів та їх кордонів, що утворюються на фронті осадження плівки. Кордони кластерів, ті, що утворюються при контактуванні первинних острівців за рахунок утворення м'яких ТШЗ є місцями максимальної шільності адсорбційних центрів високою теплотою адсорбції. Ці місця залишаються і при подальшому зростанні плівки міснями найбільш інтенсивних

процесів адсорбції газових молекул із збільшенням ширини ОНЩ, що легко реєструються електронномікроскопічним Вертикальність методом. граничних свідчить прошарків про те, ЩО ïΧ зростання дійсно здійснюється внаслідок адсорбції газу в переважної процесі осадження.

Неоднорідність розподілу і неоднакова ширина кластерних кордонів - це результат формування ділянок з різною сорбційною здатністю в аморфних плівках А^IBi₃ C^{VI}₅.

Потрібно підкреслити, для кластерів переважаючою є шестикутна форма, відповідна уявленням Дж.Філліпса [6,7]. Однак, для деяких кластерів відбувається спотворення форми (п'ятикутна семикутна на рис.1), що може бути переорієнтацією пояснено зв'язків за рахунок впровадження газових домішок.

Природньо передбачити, що наявність домішкових газів в конденсаті впливає на закономірності окислення такого об'єкта. Раніше нами [11] методом масспектрометрії повторних іонів було плівок KBi₃S₅, показано, що для отриманих у вакуумі 10-5Па і 10-3Па, відбувається зміна закономірностей окислення. Залежність швидкості окислення від вакуумних умов отримання плівок є гарним підтвердженням впливу адсорбції залишкових газів на формування структури конденсатів.

Утворення стовпчастої структури відображає ступінь анізотропії об'єктів, що вивчаються. Це необхідно враховувати при інтерпретації різниці фізичних властивостей в площині плівки, і перпендикулярному їй напрямі. Зокрема, кордони стовпів можуть служити легкими каналами дифузії в аморфних плівках, прискорюючими процес перенесення речовини в напрямі, перпендикулярному площині зразка.

V. Висновок

Таким чином, на основі комплексного електронномікроскопічного дослідження встановлена стовпчаста структура росту аморфних плівок складних халькогенідних А^IВі₃С^{VI}₅. Запропонований сполук типу механізм її формування. Виявленню такої структури сприяє впровадження В зростаючу плівку домішок із залишкових вакуумної установки. газів Зміна середнього діаметра стовпів залежить від хімічного складу конденсату, шо досліджується. Формування стовпчастої структури пояснюється за допомогою моделі трицентрових зв'язків R безперервній неврегульованій сітці.

- [1] Аморфные полупроводники, под ред. М.Бродски, М., Мир (1982).
- [2] А.Фельц, Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела, М., Мир (1986).
- [3] A.G.Dirks, H.J.Leamy. Columnar microstructure in vapour-deposited thin films // *Thin Solid Films*, 47, pp.219 233 (1977).
- [4] Н.Г.Находкин, А.І.Новосельская, А.Ф.Бардамид. Структура плёнок аморфного Ge // Физика и техника полупроводников, 19, с.1918 1927 (1985).
- [5] Л.Н.Панченко, А.И.Семененко, В.А.Базакуца, В.И.Белозерцева. Применение эллипсометрии для изучения фотоиндуцированных изменений оптических параметров тонких плёнок соединений Ag₂(Tl₃)SbS₃ // Квантовая электроника, 47, с.58 64 (1995).
- [6] J.C. Phillips. Topology of covalent non-crystaline solids. Medium-range order in chalcogenide alloys and α Si (Ge) // J. of Non-Cryst.Solids, 43, pp.37 77 (1981).
- [7] J.C. Phillips. Chemical bounding and heats of formation in chalcogenide network compounds As₂ (S, Se)₃ and Ge (S, Se)₂ // *Physical Review*, 28, pp.28 29 (1983).
- [8] М.И.Головей, Е.Е.Семрад, Е.Ю.Переш, Ю.В.Ворошилов. Некоторые свойства и характер химической связи в соединениях типа $A^{I}B^{V}C^{VI}_{2}$ на основе щелочных металлов // В сб. статей "Некоторые вопросы химии и физики полупроводников сложного состава", с.59 69, Ужгород (1970).
- [9] В.Б.Лазарев, А.В.Салов, С.И.Беруль. *Тройные полупроводниковые соединения в системах* $A^{I}B^{V}C^{VI}$, М., Наука (1982).

[10] С.А.Дембовский, Е.А.Чечеткина. Стеклообразование, М., Наука (1990).

[11] В.А.Базакуца, Н.И.Гнидаш, Н.Л.Дьяконенко, А.А.Рябчун. Влияние вакуумных условий получения плёнок на кинетику процессов окисления // Вопросы атомной науки и техники, Сер.Ядерно-физические исследования, 27, с.74 - 76 (1994).

Microstructure of amorphous films of A^IBi₃C^{VI}₅ system semiconducting materials

Bazakutsa V.A., Ryabchun A.A., Dyakonenko N.L., Shelest I.V., Belozertseva V.I.

The structure investigations of amorphous films obtained from complex halcogenides $A^{I}Bi_{3}C^{VI}_{5}$ (A^{I} - Li, K, Rb; C^{VI} - S, Se) were carried out by transmission electron microscopy and electron diffraction. It was established the microstructure peculiarities, in particulary the column growth structure of amorphous layers depending on the preparation conditions. The influence of chemical composition of evaporated material on the average column size was found.

The column structure formation mechanism based on the model of soft three-centered bonds in the hard covalent network was suggested.

Keywords: halcogenides compounds, amorphous films, condensation, column microstructure.